							,		
					'' Re		Reexaminati	pplicant(s)/Patent Under Reexamination NOUE ET AL.	
Notice of References Cited					Examiner Art Unit		Art Unit		
					Caridad M. Everhart 2825			Page 1 of 1	
 :		<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	U.S. P	ATENT DOCUM	ENTS			
*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY	Name				Classification	
	A	US-2001/0041421	11-2001	Park et al.				438/424	
	В	US-6,180,490	01-2001	Vassiliev et al.				438/424	
	С	US-4,877,641	10-1989	Dory, Thomas S.				427/574	
-	D	US-4,877,651	10-1989	Dory, Thomas S.				427/255.18	
	E	US-6,590,271	07-2003	Liu et al.				257/510	
	F	US-6,258,695	07-2001	Dunn et al.				438/424	
	G	US-							
	н	US-				·.	·		
	ı	US-							
	J	US-							
	к	US-							
	L	US-							
•	М	US-							
				FOREIG	N PATENT DOO	UMENTS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY		Country	Name		Classification	
	Ν								
	0								
	Φ.			ļ					
	Q								
	R								
	S				·				
	T								
	* Include as applicable: Author, Title Date, Publisher, Edition or Volume, Pertinent Pages)								
*		inclu	ude as applicab	le: Author	, Title Date, Publ	isher, Edition or Vol	ume, Pertinent Page	s)	
	U								
	V								
<u> </u>	w		; ,						
1		,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	
	x				•		•		

*A copy of this reference is not being furnished with this Office action. (See MPEP § 707.05(a).)

Dates in MM-YYYY format are publication dates. Classifications may be US or foreign.

U.S. Patent and Trademark Office